



Opublikowano dnia 20 kwietnia 1956 r.



G 01 r 13/20

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ **OPIIS PATENTOWY**

Nr 39124

Kl. 42 h, 38

Politechnika Warszawska
(Zakład Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii *)
Warszawa, Polska

Sposób odwzorowania przebiegów przestrzennych za pomocą dwóch lub więcej wiązek elektronowych i urządzenie do przestrzennego odwzorowania przebiegów przestrzennych

Patent trwa od dnia 12 lipca 1955 r.

Wynalazek dotyczy elektronowych sposobów odwzorowania przebiegów w przestrzeni, zwłaszcza sposobów elektronowego odwzorowania przebiegów przestrzennych opisanych w patentach NN 38662 i 38721.

W tych przypadkach, gdy celem odwzorowania jest nie tylko jakościowe zbadanie przebiegów przestrzennych, lecz również pomiar współrzędnych przebiegów, to według wynalazku taki przebieg przestrzenny odwzorowuje się w przestrzeni o elektronowo wyznaczonych współrzędnych.

Współrzędne przestrzenne mogą być wyznaczone według wynalazku przez wytworzenie w przestrzeni w sposób elektronowy świecącej siatki przestrzennej z linii pełnych lub przerywanych. Siatka taka stanowi skalę, z której można odczytać współrzędne z poszczególnych punktów krzywej odwzorowanego przebiegu.

Według jednego ze sposobów według wynalazku siatkę taką wytwarza się za pomocą tej pary wiązek elektronowych, która służy do odwzorowania badanego przebiegu. W tym celu wiązki te steruje się poprzez odpowiednie przełączniki elektronowe lub inne np. takie, jakie są stosowane do reprodukcji dwóch przebiegów na ekranie lampy oscyloskopowej o jednej wiązce elektronowej.

Można też według wynalazku siatkę współrzędnych wytworzyć za pomocą dodatkowej pary wiązek; niezależnych od wiązek odwzorowujących przebieg przestrzenny. W tym przypadku lampa do przestrzennego odwzorowania przebiegów posiada co najmniej 2 pary wiązek elektronowych.

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcami wynalazku są Antoni Kiliński i January Kossakowski.

Zastosowanie przestrzennej siatki współrzędnych czyni z urządzenia do odwzorowania przebiegów i wielkości przestrzennych miernik, którym mierzy się od razu 3 składowe danej wielkości. Szczególne zalety posiada wynalazek przy zastosowaniu go w urządzeniach do tenzometrii przestrzennej.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób odwzorowania przebiegów przestrzennych za pomocą dwóch lub więcej wiązek elektronowych przecinających się w gazowej przestrzeni, znamienne tym, że przebieg odwzorowuje się w przestrzeni o elektronowo wyznaczonych współrzędnych jej punktów.
2. Sposób odwzorowania według zastrz. 1, znamienne tym, że współrzędne przestrzeni wyznacza się przez wytworzenie w sposób elektronowy świecącej siatki przestrzennej z linii pełnych lub przerywanych.
3. Sposób odwzorowania według zastrz. 2, znamienne tym, że siatkę przestrzenną wytwarza się stosując przełączniki elektronowe lub inne za pomocą tej samej pary wiązek elektronowych, które służą do odwzorowania badanego przebiegu.
4. Sposób odwzorowania według zastrz. 2, znamienne tym, że siatkę przestrzenną wytwarza się za pomocą osobnej pary wiązek promieni elektronowych.
5. Urządzenie do przestrzennego odwzorowania przebiegów przestrzennych w sposób według zastrz. 1, 2, 4 znamienne tym, że lampa do przestrzennego odwzorowania przebiegów posiada prócz zespołu elektrod do odwzorowania przestrzennego badanych przebiegów jeszcze zespół elektrod do wytwarzania siatki przestrzennej.

Politechnika Warszawska

(Zakład Konstrukcji
Telekomunikacyjnych i Radiofonii)